

ИЗВЕСТИЯ  
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА

Том 164

1967

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУРЬМЫ В АРСЕНИДЕ ГАЛЛИЯ МЕТОДОМ  
АМАЛЬГАМНОЙ ПОЛЯРОГРАФИИ

Э. А. ЗАХАРОВА, З. Г. КИЛИНА

(Представлена научно-методическим семинаром ХТФ)

В литературе есть данные о полярографическом поведении Sb (+5) на солянокислых фонах [1, 2], а также исследовано поведение Sb (+3) на солянокислых фонах методом АПН [3, 4], но в литературе нет данных о получении анодного зубца Sb (+5) на этих фонах.

В процессе анализа GaAs навеска GaAs разлагается в смеси  $\text{HNO}_3 + \text{HCl}$ , причем Sb и As окисляются до 5-валентного состояния. Для упрощения хода анализа основные компоненты Ga (+3) и As (+5) не удалялись, а Sb (+5) не восстановлялась до Sb (+3). В связи с этим нами исследовано амальгамно-полярографическое поведение Sb (+5) на солянокислых фонах разной концентрации, а также предложена методика определения Sb (+5) в GaAs без отделения основы с использованием ртутной капли.

Все определения проводились на полярографе типа ОН-101, скорость изменения потенциала 333 мв/мин. В работе использовался электролизер со вставными стаканчиками. Стационарным электродом служила ртутная капля, полученная осаждением ртути, выделяющейся при электролизе из раствора азотистокислой ртути в течение 60 сек при силе тока 30 ма. Электродом сравнения служил нас. к. э., относительно которого приводятся все значения потенциалов.

Для приготовления стандартного раствора Sb (+5) 0,1 г металлической сурьмы нагревали в фторопластовой чашке с 2 мл  $\text{H}_2\text{SO}_4$  ( $d = 1.84$ ) до растворения ее, прибавляли 10 мл  $\text{HCl}$  (6 N), затем по каплям добавляли  $\text{H}_2\text{O}_2$  (5 мл). Для разложения  $\text{H}_2\text{O}_2$  в течение часа нагревали раствор при  $t = 60^\circ$ , добавляя 6 N HCl, содержимое чашки переносили в мерную колбу на 100 мл и доводили до метки 6 N HCl. Стандарт устойчив в течение нескольких месяцев.

Растворы меньшей концентрации готовили последовательным разбавлением головного эталона.

Используемые растворы  $8 \cdot 10^{-6}$  М,  $8 \cdot 10^{-7}$  М готовили через каждые 3—4 дня.

Для приготовления стандартных растворов использовали тридистиллат, серную кислоту марки (х.ч.) солянную кислоту (6-9 N) очищали изопиестическим методом, перекись водорода марки особой чистоты.

Результаты некоторых исследований по амальгамно-полярографическому поведению Sb (+5) на солянокислых фонах разной концентрации представлены в табл. 1.

Наблюдаемое уменьшение зубца на 2 и 3 N HCl объясняется, по-видимому, склонностью Sb (+5) к гидролизу. Для работы был выбран фон 4 N HCl.

Изучено влияние потенциала электролиза на анодный зубец Sb (+5) в интервале  $-0,3 \div 0,9$  в. Как видно из рис. 1, начиная с потенциала  $-0,5$  в, анодный зубец Sb (+5), остается постоянным (см. рис. 1). Накопление Sb (+5) проводили при потенциале  $-0,6$  в.

Градуировочный график Sb (+5) в интервале концентраций  $2,5 \cdot 10^{-8}$  г-ион/л  $\text{--} 10^{-8}$

Таблица 1

**Амальгамно-полярографическое поведение  
Sb(+5) на солянокислых фонах**

Условия опытов:  $C_{\text{Sb}} = 4 \cdot 10^{-7}$  г-ион/л,  $\tau = 5$  мин,  
 $i^* = 1 \cdot 10^{-8}$  а/мм

Концентрация HCl, N	$\varphi_n \text{Sb (+5)},$ б	$I \cdot 10^8,$ а	$\varphi$ растворения Hg, б
1,0			
2,0	-0,16	1	-0,10
3,0	-0,18	15	-0,16
4,0	-0,25	22	-0,18
5,0	-0,26	22	-0,19
6,0	-0,27	21	-0,19

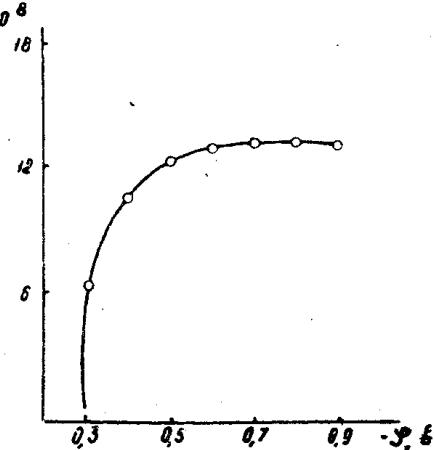


Рис. 1. Влияние потенциала электролиза на глубину анодного зубца Sb (+5) на фоне 4 N HCl. Условия опыта:  $C_{\text{Sb}} (+5) = 4 \cdot 10^{-7}$  г-ион/л;  $\tau = 5$  мин,  $i^* = 2 \cdot 10^{-9}$  а/мм,  $V = 5$  мл.

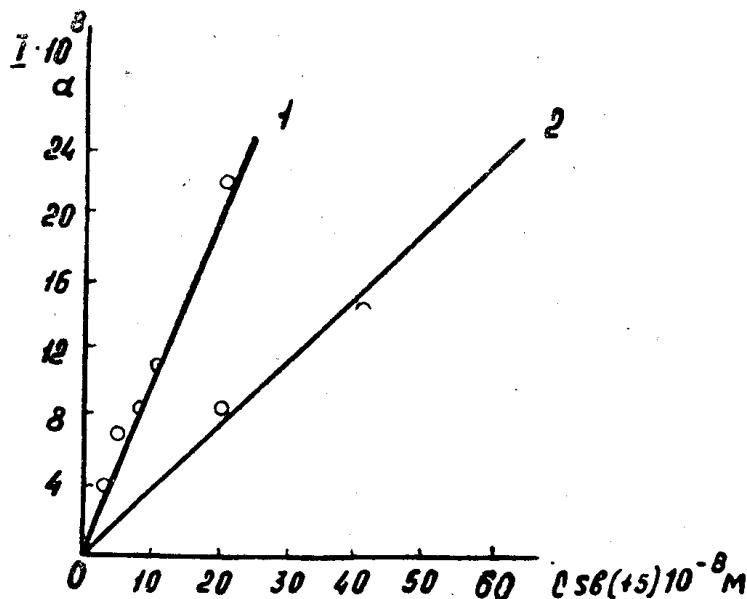


Рис. 2. Градуировочный график Sb (+5) на фоне 4 N HCl (кривая 1) и в присутствии As (+5) и Ga (+3), (кривая 2). Условия опытов:  $i^* = 2 \cdot 10^{-9}$  а/мм;  $\tau = 10$  мин;  $V = 5$  мл;  $r = 0,04$  см.

$-2 \cdot 10^{-7}$  г-ион/л на фоне чистой 4 N HCl и в присутствии As (+5) и Ga (+3) в интервале концентраций  $2 \cdot 10^{-7}$  г-ион/л  $\text{--} 8 \cdot 10^{-7}$  г-ион/л представлен на рис. 2.

Анодные зубцы Sb (+5) на фоне As (+5) и Ga (+3) + 4 N HCl представлены на рис. 3.

Определению Sb (+5) на ртутной капле в условиях анализа не мешает 3-кратный избыток Cu, если снимать зубцы Cu и Sb (+5) с остановкой потенциала после получения анодных пиков. Потенциалы анодных пиков на фоне 4 N HCl для Sb (+5), Cu равны соответственно — 0,25 в — 0,35 в.

На основании проведенных исследований разработана следующая методика определения микроКонцентраций Sb (+5) в GaAs.

Навеску измельченного GaAs 0,2 г растворяют в кварцевом стаканчике в 1 мл HNO<sub>3</sub> в присутствии 0,5 мл 9 N HCl при  $t = 70^{\circ}$ —80° в течение 30 минут и выпаривают досуха в течение 3 часов. Затем добавляют 3 мл 4 N HCl.

Стаканчик вставляют в электролизер, пропускают через исследуемый раствор, очищенный от кислорода щелочным раствором пирогаллола водород, и проводят электролитическое накопление в течение

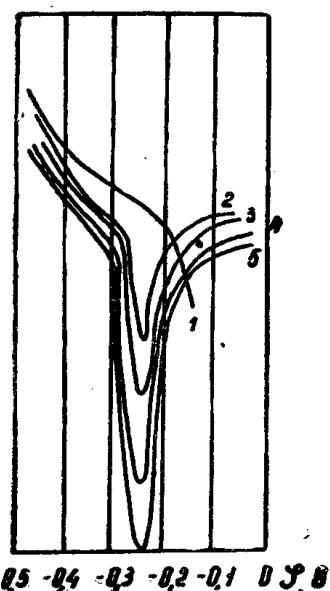


Рис. 3. Анодные зубцы Sb (+5) на фоне As (+5) + Ga (+3) + 4 N HCl, кри-  
вая 1 — фон, 2 — 2.  
 $\cdot 10^{-7}$  г-ион/л, 3—4.  
 $\cdot 10^{-7}$  г-ион/л, 4— $6 \cdot 10^{-7}$   
г-ион/л, 5— $8 \cdot 10^{-7}$  г-ион/л.  
Условия опыта:  $\tau = 5$  мин;  
 $V = 5$  мл;  $\varphi_{эл} = -0,6$  в;  
 $i^* = 2 \cdot 10^{-9}$  а/мм. При по-  
лучении зубцов делалась  
остановка изменения потен-  
циала.

10 минут при перемешивании раствора магнитной мешалкой и потенциале — 0,6 в.

В исследуемых образцах GaAs Sb (+5) не была обнаружена, поэтому Sb (+5) вводилась в отдельные навески GaAs перед разложением и затем анализировалась, как описано выше. Результаты опытов представлены в табл. 2.

Максимальная чувствительность методики  $4 \cdot 10^{-6}\%$  при навеске GaAs 0,2 г, объем раствора 3 мл и времени электролиза 10 минут.

### Выводы

1. Исследовано амальгамно-полярографическое поведение сурьмы (+5) на солянокислых фонах разной концентрации.

2. Разработана методика определения Sb (+5) в GaAs с чувствительностью  $4 \cdot 10^{-6}\%$ .

### ЛИТЕРАТУРА

- I. Kolthoff, R. Probst. Anal. Chem., 21, 753, 1949.
- J. Lingane. J. Am. Chem. Soc., 69, 530, 1947.
- Л. Ф. Заичко, В. Ф. Янкаускас, М. С. Захаров. Завод. лабор., 265, 1965.
- Л. Ф. Заичко, М. С. Захаров. Сб. методы анализа химических реактивов и препаратов, ИРЕА, вып. 5—6, стр. 79, 1963.